

改訂版

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005年6月9日 (09.06.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/052975 A1

- (51) 国際特許分類⁷: H01J 9/42 (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電
器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUS-
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/017668 TRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大
字門真 1 0 0 6 番地 Osaka (JP).
(22) 国際出願日: 2004年11月22日 (22.11.2004) (72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 伊倉 恒生
(25) 国際出願の言語: 日本語 (IKURA, Tsuneo). 脇谷 敬夫 (WAKITANI, Takao).
(26) 国際公開の言語: 日本語 (74) 代理人: 岩橋 文雄, 外 (IWAHASHI, Fumio et al.); 〒
5718501 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 松下電
(30) 優先権データ: 器産業株式会社内 Osaka (JP).
特願 2003-396913 (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
2003年11月27日 (27.11.2003) JP [続業有]

(54) Title: PLASMA DISPLAY PANEL LIGHTING INSPECTING METHOD

(54) 発明の名称: プラズマディスプレイパネルの点灯検査方法

A Rセル	B								
	行	1SF	2SF	3SF	4SF	5SF	6SF	7SF	8SF
	C 奇数行	○	○	○	×	×	×	×	×
	D 偶数行	×	×	×	×	×	×	×	×

E Gセル	B								
	行	1SF	2SF	3SF	4SF	5SF	6SF	7SF	8SF
	C 奇数行	×	×	×	○	×	×	×	×
	D 偶数行	×	×	×	×	×	×	×	×

F Bセル	B								
	行	1SF	2SF	3SF	4SF	5SF	6SF	7SF	8SF
	C 奇数行	○	○	○	×	×	×	×	×
	D 偶数行	×	×	×	×	×	×	×	×

○: 書き込みパルスを印加する
×: 書き込みパルスを印加しない

A... R CELL
B... ROW
C... ODD ROW
D... EVEN ROW

E... G CELL
F... B CELL
G... WRITE PULSE IS APPLIED
H... WRITE PULSE IS NOT APPLIED

(57) Abstract: A method of inspecting lighting of a plasma display panel in which cells are formed at two-level crossings between electrodes arranged in the row direction and electrodes arranged in the column direction and gradation display is conducted by combining subfields constituting one field for lighting. In a predetermined subfield, not applying a write pulse voltage to a cell to be inspected a write pulse voltage is applied to at least one specific cell which is one of the cells adjacent to the cell to be inspected, and in the next subfield a write pulse voltage is applied to the cell to be inspected. If there is a defect in the partition of the cell to be inspected, the discharge in the adjacent cells adversely influences through the defective partition the amount of charge of the partition of the cell to be inspected. As a result, in the next subfield, the cell to be inspected does not light. Thus lighting failure caused by the defective partition can be detection.

[続業有]